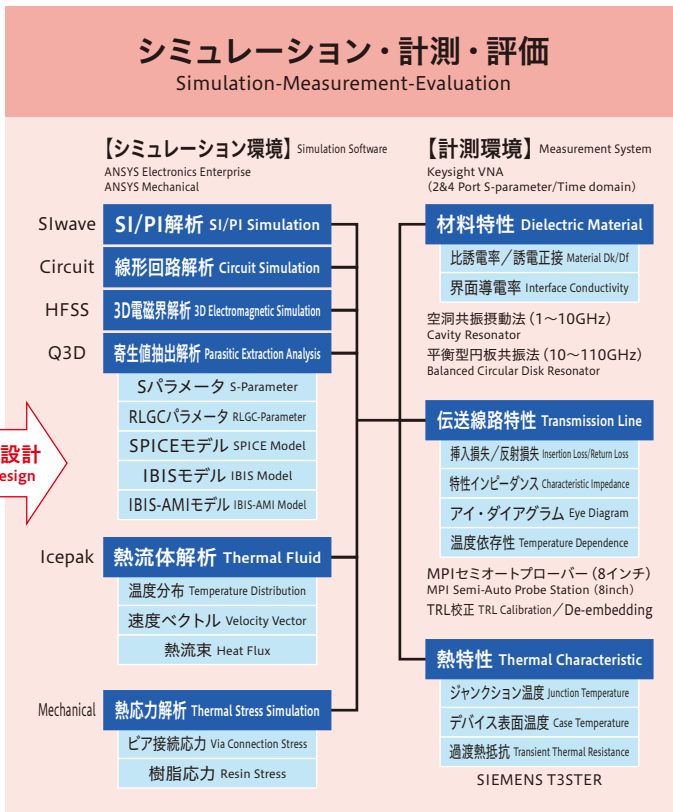


# パッケージ・ボードレベル協調設計検証のご支援

## Package-Board Level Co-Design Support



お客様 Customer	ご依頼実績 Offering Services	設計 解析 Simulation	基板 製造 Board Manufacture	チップ 部品実装 Chip/Device Ass'y	Dk/Df 計測 Dk/Df Measure	伝送線路 計測 S-Parameter Measure	加工条件 評価 Process Condition	基板分析 断面解析 PCB Analysis X-Section	信頼性 試験 Reliability Test	特性 評価 Characteristic Evaluation
材料メーカー Material Supplier	比誘電率/誘電正接/界面導電率 測定 Dk/Df/Interface Conductivity Measurement				✓					
薬液メーカー Chemical Supplier	伝送線路計測 S-Parameter Measurement	✓	✓		✓	✓				
基板メーカー PCB Supplier	材料加工条件評価 Material Process Condition Evaluation		✓				✓	✓	✓	
セットメーカー OEM Supplier	高速デジタル伝送基板 設計製造 High-Speed Board Manufacturing	✓	✓	✓		✓		✓		✓
	機能集積配線板 設計開発 Integrated Printed Subsystem Board Manufacturing	✓	✓	✓		✓			✓	✓

測定方法 Method	試料形状 DUT Size	周波数 Frequency	比誘電率 Dk 誘電正接 Df	界面導電率 Interface Conductivity	計測機器 Measurement Equipment
空洞共振器 Cavity Resonator	1x1x100 [mm]	1, 2.45, 5.8, 10 [GHz]	2~130, 0.5~0.0005	-	ベクトルネットワークアナライザ Vector Network Analyzer
平衡型円板共振器 BCDR	φ50.6x 0.2~0.4t [mm]	10~110 [GHz]	1.6~10, 0.01~0.0001	5x10 <sup>7</sup> ~1x10 <sup>6</sup> [S/m]	空洞共振器 Cavity Resonator, 平衡型円板共振器 BCDR Fixture

※ガラスコア基板の測定が可能です

装置 Equipment	仕様 Specification	計測機器 Measurement Equipment
ネットワークアナライザ VNA	KEYSIGHT N5227B	ウエハプローバ Wafer Prober
周波数範囲 Frequency	10 [MHz] ~ 110 [GHz]	RFプローブ RF Probe
温度範囲 Temperature	-40 ~ 150 [°C]	
ウエハプローバ Wafer Prober	Semi-Auto Prober	
シングルプローブ Single Probe	GSG 150/250 [μm]	
差動プローブ Differential Probe	GSSG 150/175/250 GSSG 150 [μm]	
コネクタ Connector	1.85 [mm]	

